

О ТОЧКАХ СОВПАДЕНИЯ ДВУХ МНОГОЗНАЧНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВАХ С ВЕКТОРНОЗНАЧНОЙ МЕТРИКОЙ

© Е. А. Плужникова^{1),2)}, Ю. А. Моисеев¹⁾, А. А. Репин¹⁾

¹⁾ Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
E-mail: pluznikova_elena@mail.ru, aaaum@yandex.ru, aleksejjrepin@rambler.ru

²⁾ Российский университет дружбы народов
117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
E-mail: pluznikova_elena@mail.ru

Рассмотрены пространства с векторнозначной метрикой, значениями которой являются элементы конуса линейного нормированного пространства. Для многозначных отображений сформулировано понятие накрывания (метрической регулярности) в пространствах с векторнозначной метрикой. Получено утверждение о точках совпадения метрически регулярного и липшицева многозначных отображений в пространствах с векторнозначной метрикой.

Ключевые слова: точки совпадения отображений; многозначные отображения; накрывающие отображения; метрически регулярные отображения; пространства с векторнозначной метрикой

Пусть задано непустое множество \mathcal{X} и линейное нормированное пространство E , в котором выделен некоторый замкнутый выпуклый конус E_+ . Конус задает порядок в E , то есть для любых элементов $r_1, r_2 \in E$ выполнено неравенство $r_1 \leq r_2$ тогда и только тогда, когда $r_2 - r_1 \in E_+$.

О п р е д е л е н и е 1. Отображение $\mathcal{P}_{\mathcal{X}} : \mathcal{X}^2 \rightarrow E_+$ будем называть *векторнозначной метрикой*, а $(\mathcal{X}, \mathcal{P}_{\mathcal{X}})$ — *пространством с векторнозначной метрикой*, если:

- 1) равенство $\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, u) = 0$ выполнено тогда и только тогда, когда $x = u$;
- 2) для любых $x, u \in \mathcal{X}$ справедливо $\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, u) = \mathcal{P}_{\mathcal{X}}(u, x)$;
- 3) для любых $x, u, v \in \mathcal{X}$ имеет место неравенство $\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, u) \leq \mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, v) + \mathcal{P}_{\mathcal{X}}(v, u)$.

Рассмотрим векторные аналоги определений некоторых понятий, известных для метрических пространств. *Замкнутым шаром* с центром в некоторой точке $u \in \mathcal{X}$ радиуса $r \in E_+$ в $\mathcal{X} \doteq (\mathcal{X}, \mathcal{P}_{\mathcal{X}})$ называем множество $B_{\mathcal{X}}(u, r) \doteq \{x \in \mathcal{X} : \mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, u) \leq r\}$; *r-раздутие* $B_{\mathcal{X}}(U, r)$ множества $U \subset \mathcal{X}$ определяется равенством $B_{\mathcal{X}}(U, r) \doteq \bigcup_{x \in U} B_{\mathcal{X}}(x, r)$. Сходимость в \mathcal{X} определяется естественным образом. Пусть даны последовательность $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$ и элемент $x \in \mathcal{X}$. Под сходимостью $x_n \rightarrow x$ при $n \rightarrow \infty$ в \mathcal{X} понимаем сходимость $\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x_n, x) \rightarrow 0$ в E , то есть $\|\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x_n, x)\|_E \rightarrow 0$. Множество $U \subset \mathcal{X}$ *замкнуто*, если для любой сходящейся последовательности его элементов $\{x_n\} \subset U$, $x_n \rightarrow x$ выполнено $x \in U$. Заметим, что замкнутый шар $B_{\mathcal{X}}(u, r)$ будет замкнутым множеством в \mathcal{X} . Последовательность $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$ будем называть *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N \quad \forall m > N \quad \|\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x_n, x_m)\|_E < \varepsilon.$$

Если любая фундаментальная последовательность в \mathcal{X} сходится, то это пространство называется *полным*.

Обозначим $\text{Cl}(\mathcal{X})$ — совокупность всех непустых замкнутых подмножеств пространства \mathcal{X} . Отметим, что на пространства с векторнозначной метрикой не переносятся понятия расстояния от точки до множества и расстояния по Хаусдорфу между множествами, поскольку ограниченное множество в E_+ может не иметь инфимума (в отличие от линейного порядка в \mathbb{R} упорядоченность в E частичная).

Пусть E, M — некоторые линейные нормированные пространства с заданными замкнутыми выпуклыми конусами E_+, M_+ ; пусть \mathcal{X}, \mathcal{Y} — пространства с векторнозначными метриками $\mathcal{P}_{\mathcal{X}}: \mathcal{X}^2 \rightarrow E_+, \mathcal{P}_{\mathcal{Y}}: \mathcal{Y}^2 \rightarrow M_+$. В пространстве $\mathcal{L}(M, E)$ линейных ограниченных операторов $F: M \rightarrow E$ определим множество положительных операторов

$$\mathcal{L}(M, E)_+ \doteq \{F: M \rightarrow E \mid F(M_+) \subset E_+\},$$

очевидно являющееся замкнутым выпуклым конусом. Обозначим $I_E: E \rightarrow E$ — тождественный оператор. Имеем $I_E \in \mathcal{L}(E, E)_+$.

О п р е д е л е н и е 2. Отображение $\Psi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ будем называть *регулярным с коэффициентом* $K \in \mathcal{L}(M, E)_+$ или *K -регулярным (относительно векторнозначных метрик)*, если для любых $x_0 \in \mathcal{X}, y_0 \in \Psi(x_0), y \in \mathcal{Y}$ существует такой $x \in \mathcal{X}$, что $y \in \Psi(x)$ и имеет место оценка

$$\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, x_0) \leq K \mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(y, y_0).$$

Свойство регулярности относительно векторнозначных метрик эквивалентно следующему включению

$$\forall r \in M_+ \quad \forall x_0 \in \mathcal{X} \quad \text{Ву}(\Psi(x_0), r) \subset \Psi(\text{В}_{\mathcal{X}}(x_0, Kr)),$$

поэтому будем также называть данное отображение *K -накрывающим (относительно векторнозначных метрик)* (см. [1–4]). Таким образом, отображение $\Psi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ является регулярным тогда и только тогда, когда оно накрывающее.

Для формулировки основного результата определим еще одно понятие — липшицевости многозначных отображений в пространствах с векторнозначной метрикой.

О п р е д е л е н и е 3. Отображение $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ будем называть *липшицевым с операторным коэффициентом* $Q \in \mathcal{L}(E, M)_+$ или *Q -липшицевым (относительно векторнозначных метрик)*, если для любых $x_0, x \in \mathcal{X}, y_0 \in \Phi(x_0)$ существует такой $y \in \Phi(x)$, что выполнено

$$\mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(y, y_0) \leq Q \mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, x_0).$$

Отметим, что данное соотношение равносильно включению

$$\forall x_0, x \in \mathcal{X} \quad \Phi(x) \subset \text{Ву}(\Phi(x_0), Q \mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x_0, x)).$$

Для отображения $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ стандартно определим график — множество $\text{grh}(\Phi) \doteq \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} : y \in \Phi(x), x \in \mathcal{X}\}$.

Точкой совпадения отображений $\Psi, \Phi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ называют (см. [5]) аргумент $x \in \mathcal{X}$, для которого справедливо

$$\Psi(x) \cap \Phi(x) \neq \emptyset.$$

Сформулируем утверждение, уточняющее теорему о точках совпадения многозначных отображений в пространствах с векторнозначной метрикой из работы [1].

Т е о р е м а 1. Пусть существуют такие $K \in \mathcal{L}(M, E)_+, Q \in \mathcal{L}(E, M)_+$, что отображение $\Psi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ является K -накрывающим, а отображение $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{Y})$ — Q -липшицевым (относительно векторнозначных метрик); графики этих отображений $\text{grh}(\Psi), \text{grh}(\Phi)$ замкнуты и хотя бы один из них является полным подпространством произведения $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$; пространство E является банаховым. Тогда, если для спектрального радиуса ρ линейного

ограниченного положительного оператора $KQ \in \mathcal{L}(E, E)_+$ имеет место оценка $\varrho(KQ) < 1$, то для любых $x_0 \in \mathcal{X}$, $\psi_0 \in \Psi(x_0)$, $\phi_0 \in \Phi(x_0)$ существует точка совпадения x отображений Ψ и Φ , удовлетворяющая неравенству

$$\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, x_0) \leq (I_E - KQ)^{-1} K \mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(\psi_0, \phi_0), \quad (1)$$

и существует $y \in \Psi(x_0) \cap \Phi(x_0)$ такой, что

$$\mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(y, \phi_0) \leq Q(I_E - KQ)^{-1} K \mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(\psi_0, \phi_0). \quad (2)$$

З а м е ч а н и е 1. В условии теоремы 1 можно потребовать, чтобы вместо пространства E банаховым было пространство M . В этом случае оценку (1) следует заменить равносильным неравенством

$$\mathcal{P}_{\mathcal{X}}(x, x_0) \leq K(I_M - QK)^{-1} \mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(\psi_0, \phi_0),$$

а оценку (2) нужно записать в следующем виде

$$\mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(y, \phi_0) \leq (I_M - QK)^{-1} QK \mathcal{P}_{\mathcal{Y}}(\psi_0, \phi_0).$$

З а м е ч а н и е 2. Если $E = M = \mathbb{R}$, то есть \mathcal{X} , \mathcal{Y} — «обычные» метрические пространства, то теорема 1 равносильна теореме А. В. Арутюнова из работы [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жуковский Е.С., Плужникова Е.А. Мнозначные накрывающие отображения пространств с векторнозначной метрикой в исследовании функциональных включений // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. Тамбов, 2016. Т. 21. Вып. 6. С. 1974–1982.
2. Жуковский Е.С. О точках совпадения векторных отображений // Известия высших учебных заведений. Математика. 2016. № 10. С. 14–28.
3. Zhukovskiy E.S. On coincidence points of multivalued vector mappings of metric spaces // Mathematical Notes. 2016. V. 100. № 3–4. P. 363–379.
4. Arutyunov A.V., Zhukovskiy S.E., Zhukovskiy E.S. Coincidence points principle for set-valued mappings in partially ordered spaces // Topology and its Applications. 2016. V. 201. P. 330–343.
5. Арутюнов А.В. Точки совпадения двух отображений // Функциональный анализ и его приложения. 2014. Т. 48. № 1. С. 89–93.
6. Арутюнов А.В. Задача о точках совпадения многозначных отображений и устойчивость по Уламу–Хайерсу // Доклады Академии наук. 2014. Т. 445. № 4. С. 379–383.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-01-00553, № 15-01-04601).

Поступила в редакцию 2 сентября 2017 г.

Плужникова Елена Александровна, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры функционального анализа; Российский университет дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация, доцент кафедры нелинейного анализа и оптимизации, e-mail: pluznikova_elena@mail.ru

Моисеев Юрий Анатольевич, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, аспирант, кафедра функционального анализа, e-mail: aaaum@yandex.ru

Репин Алексей Анатольевич, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, аспирант, кафедра функционального анализа, e-mail: aleksejjrepin@rambler.ru

UDC 517

DOI: 10.20310/1810-0198-2017-22-6-1309-1313

ON COINCIDENCE POINTS OF TWO MULTI-VALUED MAPPINGS IN SPACES WITH VECTOR-VALUED METRICS

© **E. A. Pluzhnikova**^{1),2)}, **Yu. A. Moiseev**¹⁾, **A. A. Repin**¹⁾

¹⁾ Tambov State University named after G.R. Derzhavin,
33 Internatsionalnaya st., Tambov, Russian Federation, 392000
E-mail: pluzhnikova_elena@mail.ru, aleksejjrepin@rambler.ru
²⁾ RUDN University
6 Miklukho-Maklay St., Moscow, Russian Federation, 117198
E-mail: pluzhnikova_elena@mail.ru

Spaces with vector-valued metrics are considered. The values of a vector-valued metric are elements of a cone in some linear normed space. The concept of covering (metric regularity) for multi-valued mappings in spaces with vector-valued metrics is formulated. A statement about coincidence points of a metrically regular and a Lipschitz multi-valued mappings in spaces with vector-valued metrics is obtained.

Keywords: coincidence points of mappings; multi-valued mappings; covering mappings; metrically regular mappings; spaces with vector-valued metrics

REFERENCES

1. *Zhukovskiy E.S., Pluzhnikova E.A.* Multi-valued covering maps spaces with vector-valued metrics in research of functional inclusions // *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences.* Tambov, 2016. V. 21. Iss. 6. P. 1974–1982.
2. *Zhukovskiy E.S.* On Coincidence Points for Vector Mappings // *Russian Mathematics.* 2016. V. 60. Iss. 10. P. 10–22.
3. *Zhukovskiy E.S.* On coincidence points of multivalued vector mappings of metric spaces // *Mathematical Notes.* 2016. V. 100. Iss. 3–4. P. 363–379.
4. *Arutyunov A.V., Zhukovskiy S.E., Zhukovskiy E.S.* Coincidence points principle for set-valued mappings in partially ordered spaces // *Topology and its Applications.* 2016. V. 201. P. 330–343.
5. *Arutyunov A.V.* Coincidence points of two maps // *Functional Analysis and Its Applications.* 2014. V. 48. Iss. 1. P. 72–75.
6. *Arutyunov A.V.* Zadacha o tochkah sovpadeniya mnogoznachnykh otobrazheniy i ustoychivost' po Ulamu–Hayersu // *Doklady Akademii nauk.* 2014. T. 445. № 4. S. 379–383.

ACKNOWLEDGEMENTS: The work is partially supported by the Russian Fund for Basic Research (projects № 17-01-00553, № 15-01-04601).

Received 2 September 2017

Pluzhnikova Elena Aleksandrovna, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor of the Functional Analysis Department; RUDN University, Moscow, the Russian Federation, Associate Professor of the Nonlinear Analysis and Optimization Department, e-mail: pluzhnikova_elena@mail.ru

Moiseev Yuriy Anatol'evich, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, Post-graduate student, Functional Analysis Department, e-mail: aaaum@yandex.ru

Repin Alexey Anatol'evich, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, the Russian Federation, Post-graduate student, Functional Analysis Department, e-mail: aleksejjrepin@rambler.ru

Для цитирования: Плужникова Е.А., Моисеев Ю.А., Репин А.А. О точках совпадения двух многозначных отображений в пространствах с векторнозначной метрикой // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. Тамбов, 2017. Т. 22. Вып. 6. С. 1309–1313. DOI: 10.20310/1810-0198-2017-22-6-1309-1313.

For citation: Pluzhnikova E.A., Moiseev Yu.A., Repin A.A. O tochkah sovpadeniya dvuh mnogoznachnykh otobrazheniy v prostranstvakh s vektornoznachnoy metrikoy [On coincidence points of two multi-valued mappings in spaces with vector-valued metrics]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences*, 2017, vol. 22, no. 6, pp. 1309–1313. DOI: 10.20310/1810-0198-2017-22-6-1309-1313 (In Russian, Abstr. in Engl.).